# 二つの超伝導ドームを持つ電子ドープ型鉄系超伝導体 $LaFeAsO_{1-x}H_x$

東京工業大学 応用セラミックス研究所 飯村 壮史、松石 聡、佐藤 光 半那 拓、村場 Sungkyunkwan University 聖雄 東京工業大学 応用セラミックス研究所 細野 秀雄

## Abstract

 $LaFeAsO_{1-x}F_x$ はホール面と電子面から構成される二次元フェルミ面を持っており、それらの形状がよ く似ているため、これらのポケット間に働く強いネスティング;ある波数に対するフェルミ面の重なり具 合、が母相の構造および磁気相転移を誘起する。O<sup>2-</sup>サイトをF-に置換することにより電子ドーピングす ると、これらの相転移が抑制され0.05 < x < 0.2において最高で $T_{\rm C} = 26~{
m K}$ の超伝導が発現する。しかし、 フッ素の酸素サイトへの固溶量がLaOFの生成によって制限されるために、電子ドーピングによって超伝 導が完全に消失する過剰ドーピング領域をこれまで観察できていなかった。そこで我々は新しい電子ドー パントとして水素を用い、この問題の解決を試みた。フッ素の代替として水素を用いることにより x~0.5 まで電子をドープすることに成功し、LaFeAsO $_{1-x}$ F $_x$ に見られていた超伝導ドーム(0.05 < x < 0.20)に 加えて0.2 < x < 0.5に最高で $T_C = 36$  Kを示す二つ目のドームを見出した。電子構造計算によれば、xの 増加に従いフェルミ面のネスティングは単調に弱くなるが、鉄の三つの3d軌道、 $d_{xx}$ 、 $d_{yx}$ 、 $d_{zx}$ から成る バンドがx = 0.36 において縮退することが分かった。これらの結果から高い  $T_{
m C}$ の発現にはバンド縮退が重 要な寄与を果たしていると考えられる。

2008年初頭にLaFeAsO<sub>1-x</sub>F<sub>x</sub>が26 Kで超伝導 転移を示すことが発見されて以降<sup>[1]</sup>、Feの正方格 子をもつ様々な物質が研究されてきた<sup>[2-4]</sup>。現在、 超伝導転移温度( $T_{
m C}$ )は1111系と呼ばれる  $LnFeAsO_{1-x}F_x(Ln = ランタノイド)$  において最 高 55 Kまで上昇している<sup>[5]</sup>。LaFeAsO<sub>1-x</sub>F<sub>x</sub>は常 温で正方晶の常磁性金属であり、150 Kで正方晶-斜方晶転移と反強磁性 (AFM) 転移を示す<sup>[6,7]</sup>。 これらの相転移をキャリアドーピングもしくは外圧 の印加によって抑制すると、超伝導が発現する。 AFM秩序近傍で超伝導が生じることから、その起 源としてホール面と電子面間のネスティングによっ て生じるスピンのゆらぎが提案されており<sup>[8,9]</sup>、 このモデルは過剰電子ドーピングによる超伝導の消 失や、各超伝導体による T<sub>C</sub>の違いをフェルミ面の ネスティングから説明することに成功している<sup>[10]</sup>。 しかし、これまで報告されている *Ln*FeAsO<sub>1-x</sub>  $F_{x}(Ln = La 以外)$  の電子相図は酸素サイトに対す るフッ素の固溶限界が低いためにドーピングによっ て T<sub>C</sub>が減少する領域が見られず不完全なもので あった。最近、我々は酸素に対し高い固溶限界をも つ水素を用いて、(Ce, Sm) FeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の合成と その完全な相図を報告してきた<sup>[11, 12]</sup>。中性子回折 実験とDFT計算から、水素は一価のアニオンとし て排他的に酸素サイトを占有し、フッ素アニオン と同様に電子ドーパントとして働くことが分かっ  $\mathcal{E} (O^{2-} = H^- + e^-)_{\circ}$ 

LaFeAsO $_{1-x}$ F $_x$ と(Ce, Sm)FeAsO $_{1-x}$ H $_x$ の超 伝導ドームを比較すると、La系は(Ce, Sm)系に比 ベ幅が狭く、また最高の $T_{\rm C}$ も低い。加えて  $LaFeAsO_{1-x}F_x$ の常伝導状態における電気抵抗は フェルミ液体理論に従って温度に対し二乗で上昇す るが[13]、(Ce, Sm)  $FeAsO_{1-x}H_x$ は温度に対して リニアに抵抗が増加する非フェルミ液体的な挙動を 示す。これらの違いが生じる原因として、フッ素置 換では電子量が十分ではなく、LaFeAsOの真の物 性を引き出せていない可能性が考えられる。

本研究では、Ln-1111のひな形物質である LaFeAsOに対し、フッ素の代わりに水素を用いて その電気特性および磁気特性を調べた。また、 SPring-8の高輝度放射光を用いた低温 X線回折か ら求めた結晶構造を用いてDFT計算を行い、得ら れた超伝導の起源についても議論した。

Fig. 1 a, bに LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の電気抵抗の温度 依存性を示す。x = 0.01、0.04では150 K付近に 構造、磁気相転移に起因する抵抗のキンクが見られ る。xが増加すると相転移は抑制されx > 0.08で超 伝導に起因する零抵抗が見られる。 $T_C$ はx=0.08で29 Kとなり、x = 0.21では18 Kまで減少する。 さらに電子をドープすると、 $T_C$ はx = 0.36で36 K まで上昇し、抵抗は温度に対してリニアに変化する。 Fig. 1 e, fに各サンプルの体積磁気感受率の温度依 存性を示す。金属Feの不純物があるため、すべて の磁化率にはその強磁性成分がオフセットとして 入っている。 $0.08 \le x \le 0.46$ ではいずれのサンプ ルも遮蔽体積分率が40%を超えているが、x = 0.53になると20%以下まで減少する。

Fig. 2 a-d に  $\rho(T)$  曲線の圧力依存性を示す。 x = 0.08、0.21 および 0.30 では圧力に対しオン セット  $T_{\rm C}$ が単調に上昇するが、x=0.46では常圧 下の T<sub>C</sub> = 33 Kが2.7 GPaにおいて32 Kに減少す る。常圧下での  $T_{C}(x)$  は x = 0.21 周りに谷を持つ が、それは高圧下で消失する。Fig. 2 eに  $LaFeAsO_{1-x}H_x$ の常圧、および3 GPa下における  $T_C$ と常圧下の  $T_S$ をまとめて示す。x = 0.08 と x = 0.36を頂点として二つの超伝導ドームが見て取れる。一 つ目のドームは構造相転移とAFM転移に近接し、 LaFeAsO<sub>1-x</sub>F<sub>x</sub>のドームとよく一致している。一 方で、二つ目のドームは一つ目のドームの高ドープ 側に隣接している。3 GPa下ではその二つのドーム は合体し幅の広いドームとなり、その形状と最高  $T_{\rm C}$ は ${\rm CeFeAsO}_{1-x}$   $H_x$ とよく一致する。これは LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の収縮率をLaFeAsO<sub>1-x</sub>F<sub>x</sub>と同等 であると仮定すると3 GPa下ではa軸長が約1%収 縮するために、3 GPa下のLaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の格子定 数が常圧下のCeFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の格子定数に近づいた

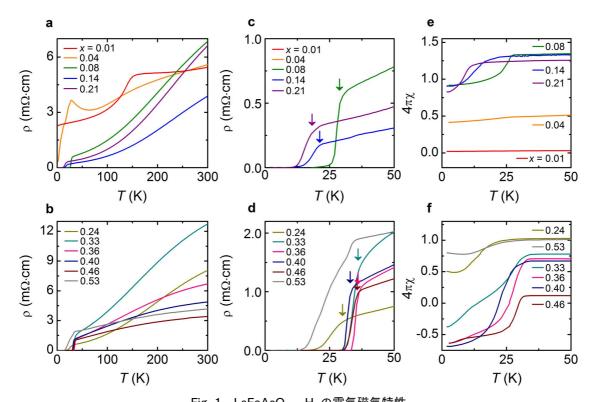


Fig. 1 LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の電気磁気特性 (a,b)x = 0.01-0.21(a) および0.24-0.53(b) における電気抵抗の温度依存性。(c,d)x = 0.01-0.21(c)および0.24-0.53(d)における  $T_{\rm C}$ 近傍における  $\rho$ -T曲線の拡大図。矢印はオンセット  $T_{\rm C}$ を示している。 (e,f)零磁場冷却、10 Oe下における x = 0.01-0.21 (e) および 0.24-0.53 (f) の磁気感受率。

ことによるものと考えられる<sup>[12, 15]</sup>。

ここでLa系と他のランタノイドを置換した1111 系の物性の差異について考える。電気抵抗の温度依 存性を比較するために、 $\rho = \rho_0 + AT^n$ で表される べき乗フィッティングを行った。Fig. 3 aに水素量 xとその乗数nの関係を示す。n=2となるフェル

b a x = 0.08x = 0.21P = 00.3 0.8 0.3 ρ (mΩ·cm) ρ (mΩ·cm) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 20 20 60 T(K)T(K)d x = 0.30x = 0.462.0 P = 0.20.9 0.9 1.5 1.0  $\rho \, (m\Omega \cdot cm)$ p (mQ·cm) 1.8 -2.3 -2.7 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0 20 60 20 60 40 T(K)T(K)е 175  $LaFeAsO_{1-x}H_x$   $LaFeAsO_{1-x}F_x$ 150 0 T<sub>s</sub> T<sub>S</sub> ■ T<sub>C</sub>  $\Box$   $T_{\rm C}$ 125 T<sub>C</sub> at 3 GPa 100 45 30 15 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fig. 2 3 GPa以下におけるLaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>の電気抵抗の温 度依存性と LaFeAsO<sub>1-x</sub>(H, F)<sub>x</sub>の相図

(a-d)静圧下における x = 0.08(a)、0.21(b)、0.30(c) お よび0.46(d) の電気抵抗の温度依存性。挿入図は $T_{C}$ の圧力 依存性を示している。(e) LaFeAsO $_{1-x}$  H $_x$  (filled symbols) および LaFeAsO $_{1-x}$  F $_x$  (open symbols)  $^{[14]}$  の電子相図。 $T_{\rm C}$ は超伝導転移の前後を外挿し、その交点とした。また電気抵 抗の温度依存性に見られるキンクをT<sub>s</sub>とした。

ミ液体的な振る舞いはLa系の低ドープ領域のみに 見られ、n<2で示される非フェルミ液体的な振る 舞いはLa系の高ドープ側および、他の1111系の 全ドープ範囲で見られる。Fig. 3bは乗数nに対す る  $T_{\rm C}$ の変化を示している。どの系においてもnが 1に近づくにつれて、 $T_{C}$ が最も高くなる。つまり、

> La系の二つ目のドームにおいて見られる非 フェルミ液体化に伴う  $T_{\mathbb{C}}$ の上昇は 1111 系 全般に見られる一般的な挙動であると言え、 一方でLa系の一つ目のドームはLa系に特 有の性質とみられる。Fig. 3 c-fにLa、Ce、 Sm および Gd-1111 の超伝導ドームを示す。 LaからGdへと格子が収縮するにつれて最 高Tcを示す電子量が連続的に低濃度側へシ フトしていることが分かる。

> LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>が示す二つの超伝導ドーム を理解するために、20 Kにおける結晶構造を 用いて電子状態の計算を行った。酸素サイト を水素で置換した電子ドーピングは仮想結晶 近似を用いて計算した。つまり、水素は電子 ドーパントとしては疑似フッ素として振る舞 い電子をFeAs層に供給すると考えた<sup>[12]</sup>。つ まり、酸素サイト(Z = 8)をZ = 8 +xの核電 荷をもつ仮想原子に置換した(ここで x は水 素量を示す)。Fig. 4 a-d に各電子量における 二次元フェルミ面を示す。ここでx = 0.08は 一つ目のドームの頂点、x = 0.21は $T_{C}$ の谷、 x = 0.36 は二つ目のドームの頂点、x = 0.4 は 過剰電子ドーピング領域になる。x = 0.08で はΓ点周りのホール面とM点周りの電子面 のサイズがよく似ており、(ππ)方向へのネ スティングが強いと考えられる。xが増加す ると、ホール面は単調に小さくなり、一方、 電子面は単調に大きくなるために、ネスティ ングは弱くなる。一方、d<sub>xv</sub>軌道から成る ホール面は電子量が増加してもその大きさ が変わらない。黒木らは鉄面からのニクト ゲンの高さが高くなると、この $d_{xv}$ ホール面 が大きくなると指摘している[10]。今のケー スの場合、電子をドープするとヒ素は徐々 に鉄面から離れていくため、電子ドーピン グによるホール面の縮小がキャンセルアウ トされているものと思われる。

> 鉄系超伝導体の場合、ホール面と電子面間 に働く強いネスティングがスピンゆらぎの

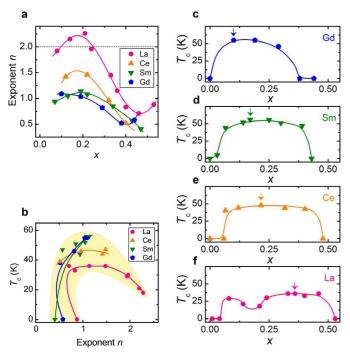


Fig. 3 ランタノイドイオンの効果

(a) LaFeAsO<sub>1-x</sub>  $H_x$  (pink circles). Ce (yellow triangles). Sm(green inverted triangles) と Gd(blue pentagons) の乗 数 nとドープ量 xの関係。乗数 nはべき乗則  $\rho = \rho_0 + AT^n$ の フィッティングから求めた。破線はフェルミ液体状態(n=2) を示している。(b)  $T_{C}$  vs.  $n_{o}$  (c-f) Ln FeAsO $_{1-x}$  H $_{x}$  [Ln = La (pink circles), Ce (yellow triangles), Sm (green inverted triangles) と Gd (blue pentagons)] の T<sub>C</sub>ドーム。矢印は最 高 *T<sub>C</sub>* を示している。

原因と考えられている[8,9]。x = 0.08からx = 0.21にかけての $T_{C}$ の減少はネスティングが弱くなった ことによるスピンゆらぎの減少として理解できるか もしれないが、二つ目のドームを形成するx<0.21 の  $T_{\mathbb{C}}$ の上昇は同様のネスティングでは説明できな い。Fig. 4 f-i に  $E_{\rm F}$ 付近のバンド構造を示す。

LaFeAsO<sub>1-v</sub>H<sub>v</sub>はユニットセル中に二つの鉄を 含むために、 $E_{\rm F}$ 付近には鉄のバンドが計十本存在 する。 $d_{yy}$ 軌道間の反結合性軌道に由来するバンド (今後 $anti-d_{xy}$ と呼ぶ) は電子ドーピングに対して大 きくエネルギーを下げ、結合性軌道に由来するバン ドとx=0.36で交差し、 $\Gamma$ 点周りで鉄の $3d_{xy}$ 、 $3d_{yz}$ 、  $3d_{xx}$ 軌道が三重縮退する。しかし、x=0.40では anti- $d_{xv}$ バンドと結合性の $d_{vz,zx}$ バンドの間で再構 成が起こり新しいバンドを作る。Fig. 4eにおいて Fe As<sub>4</sub>四面体中のAs-Fe-Asの角度がx = 0.33-0.46の高ドープ領域でも正四面体の109.5°よりもかな り離れていることに注意してほしい。つまり、Γ点 周りのバンド縮退は鉄周りの局所構造の変 化ではなく各軌道へドープされた電子の非 対称占有によって引き起こされていると思 われる。それらのバンドはΓ-Z方向にほと んど分散を持たないために、このバンド交 差は $DOS(E_E)$ を増加させ、電子系を不安定 化させる。このような場合、一般にはバンド ヤーンテラーのような構造相転移が起こる と考えられるが、今の場合  $0.08 \le x \le 0.40$ の範囲において少なくとも20 K以上ではそ のような構造相転移は見られなかった。

Table 1 に上記で述べた超伝導ドームの特 徴をまとめた。最も重要な課題は二つ目の ドームの起源、つまり 1111 系の高い  $T_{C}$ の 起源は何なのかということである。 $T_{C}$ 直上 の電気抵抗の温度依存性は x = 0.36 に向 かって  $T^2$ から Tに変化する。電子量の増加 に従い、ホール面と電子面間のネスティン グは単調に弱くなるため二つ目のドームに 対するネスティングの寄与は大きくないと 思われる。加えて、x = 0.36 まわりでは鉄 の $3d_{xy}$ 、 $3d_{yz}$ 、 $3d_{zx}$ 軌道に由来するバンド の交差により density of states が $E_{\rm F}$ 付近に 肩を持つ。これらの結果からバンド縮退が 二つ目のドームの発現に重要な寄与を与え ているように思われる。最近、母相の構造 相転移近傍でずれ弾性率のソフト化が観測

されたことをきっかけに新しいペアリングモデルが 提案されている。このモデルは斜方晶への構造相転 移によって $3d_{_{m{v}m{z}}},\ 3d_{_{m{z}m{x}}}$ 軌道の縮退が溶けると鉄の d軌道が秩序化し、その揺らぎも超伝導を誘起しうる というものである[16-18]。もし、LaFeAsO $_{1-x}$ H $_x$ が このモデルに従うとすると、電気抵抗が温度に対し

Table 1 LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>が示す二つのドームの特徴

Dome	First	Second
x	$0.05 \le x \le 0.2$	$0.2 < x \le 0.5$
Exponent <i>n</i>	$2.0 \le n \le 2.3$	$0.7 \leq n \leq 2.0$
$T_{\rm c}^{\rm \ max}$	29 K	36 K
$T_{\rm c}$ -sensitivity to $x$	High	Low
Under high pressure	Unified	
FS nesting between	Strong	Weak
hole and electron pockets		
$DOS(E_F)$	No shoulder	Shoulder

て直線的に上昇する現象は軌道ゆらぎによるキャリ アの散乱として理解できるかもしれない。

最後になぜLa系においてのみ二つのドームが見 られるのかについて考えてみる。Feの三つのバン ドの縮退は、FeAs<sub>4</sub>四面体の正四面体からの歪によ る $3d_{xv}$ 軌道と $3d_{yz,xx}$ 軌道の間のエネルギー差が、 ドープされた電子がこれらの軌道に非対称に占有さ れることによってキャンセルアウトされることで生 じる。Laサイトをより小さなランタノイドイオン に置換すると、FeAs<sub>4</sub>四面体がより正四面体に近づ くためにこのエネルギー差は小さくなる<sup>[19]</sup>。この 正四面体からのずれはLa系が特に大きい。それ故 Ce-Gd-1111ではこのバンド交差が x = 0.35 よりも

より少ない電子量で起こるはずである。その結果、 La系の場合はバンド縮退による二つ目のドームは より高ドープ領域に現れるために、フェルミ面ネス ティングによる一つ目のドームから分離して二つの 超伝導ドームを形成したのではないかと思われる。

この軌道揺らぎに対する議論はDFT計算の結果 をもとに行っている。今後このアイディアを実験的 に証明するには単結晶の角度分解能方光電子分光実 験や弾性率の測定が必要である。

## 謝辞

東京理科大学の福山秀敏教授には本研究を進める に当たり有益なご議論を交わしていただいた。厚く

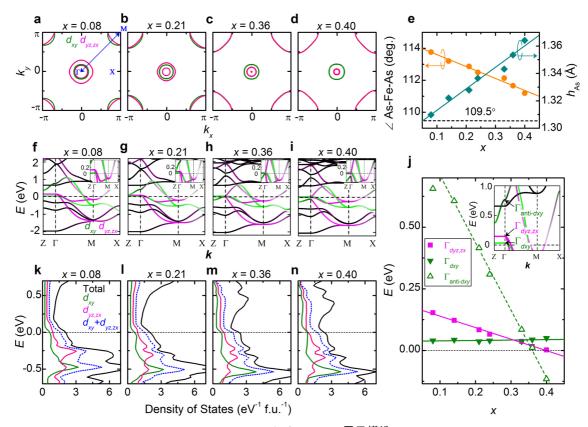


Fig. 4 LaFeAsO<sub>1-</sub>、H、の電子構造

(a-d)LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>[x = 0.08(a)、0.21(b)、0.36(c) および0.40(d)] の二次元フェルミ面。青 矢印は $(\pi\pi)$ 方向のネスティングベクトルを示している。 $\operatorname{Fe} od_{xy}$ 軌道と $d_{yz,zx}$ 軌道の寄与はそれぞれ緑とピンクで色分けしている。(e) As-Fe-As 角度と $\operatorname{Fe}$  平面からの As の高さ $(h_{\operatorname{As}})$  の電子量な行 角度と $h_{As}$ は20 K下の放射光 X線回折により求めた。(f-i) LaFeAsO $_{1-x}$  H $_x$  [x=0.08(f)、0.21(g) 0.21(g) 0.36(h) および0.40(i)] のバンド図 $^{[20]}$ 。(j)  $\Gamma$  点における Fe の 3d バンドエネルギーの電子量依存性。 挿入図はx=0.08のバンド図を示している  $[\Gamma_{dxy}( ext{open green triangles}), \Gamma_{ ext{anti-}dxy}( ext{filled green})$ inverted triangles)、 $\Gamma_{dyz, zx}$  (filled pink squares) は $\Gamma$ 点におけるFeの各3dバンドのエネルギー]。 (k-n)LaFeAsO<sub>1-x</sub>H<sub>x</sub>[x=0.08(k)、0.21(I)、0.36(m) および0.40(n)] のtotal-DOS(solid black line)、 Fe O 3 $d_{xy}$  O p-DOS (solid green line). Fe O 3 $d_{yz,zx}$  O p-DOS (pink green line). Fe O 3 $d_{xy}$   $\succeq$  3 $d_{yz,zx}$ のp-DOSの和も示してある(dotted blue line)。

お礼を申し上げる。

SPring-8での実験は2011A1142のビームタイムで得られた結果をもとにしている。実験にご協力いただいたJASRIの金延恩博士、理研の高田昌樹博士に厚くお礼を申し上げる。

また、本研究は世界最先端研究(FIRST)プログラムより補助を受けた。

## 参考文献

- [1] Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano and H. Hosono: *J. Am. Chem. Soc.* **130** (2008) 3296-3297.
- [ 2 ] M. Rotter, M. Tegel and D. Johrendt: *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 107006.
- [ 3 ] X. Wang et al.: *Solid State Commun.* **148** (2008) 538-540.
- [ 4 ] X. Zhu et al.: *Phys. Rev. B* **79** (2009) 220512.
- [ 5 ] Z. A. Ren et al.: *Chin. Phys. Lett.* **25** (2008) 2215-2216.
- [ 6 ] C. de la Cruz et al.: *Nature* **453** (2008) 899-902.
- [7] T. Nomura et al.: Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 125028.
- [8] I. I. Mazin, D. J. Singh, M. D. Johannes and M. H. Du: *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 057003.
- [ 9 ] K. Kuroki et al.: *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 087004.
- [10] K. Kuroki, H. Usui, S. Onari, R. Arita and H. Aoki: *Phys. Rev. B* **79** (2009) 224511.
- [11] T. Hanna et al.: *Phys. Rev. B* **84** (2011) 024521.
- [12] S. Matsuishi et al.: *Phys. Rev. B* **85** (2012) 014514.
- [13] M. Imada, A. Fujimori and Y. Tokura: *Rev. Mod. Phys.* **70** (1998) 1039.
- [14] C. Hess et al.: Europhys. Lett. 87 (2009) 17005.
- [15] H. Takahashi et al.: J. Phys. Soc. Jpn. **77** (2008) 78.
- [16] M. Yoshizawa et al.: *J. Phys. Soc. Jpn.* **81** (2012) 024604.
- [17] H. Kontani and S. Onari: *Phys. Rev. Lett.* **104** (2010) 157001.
- [18] Y. Yanagi, Y. Yamakawa, N. Adachi and Y. Ōno: *J. Phys. Soc. Jpn.* **79** (2010) 123707.
- [19] P. Wang, Z. M. Stadnik, C. Wang, G. H. Cao and Z. A. Xu: *J. Phys.:Condens. Matt.* **22** (2010) 145701.
- [20] M. W. Haverkort, I. S. Elfimov, L. H. Tjeng, G. A. Sawatzky and A. Damascelli: *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 026406.

#### <u>飯村 壮史 IIMURA Soshi</u>

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: s\_iimura@lucid.msl.titech.ac.jp

#### 松石 聡 MATSUISHI Satoru

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: satoru@lucid.msl.titech.ac.jp

## <u>佐藤 光 SATO Hikaru</u>

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: h\_sato@lucid.msl.titech.ac.jp

### <u>半那 拓 HANNA Taku</u>

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: taku@lucid.msl.titech.ac.jp

## 村場 善行 MURABA Yoshinori

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: muraba@lucid.msl.titech.ac.jp

#### 金 聖雄 KIM Sung Wng

Department of Energy Science, Sungkyunkwan University 300, Cheoncheon, Jangan-ku, Suwon, Korea

TEL: +81-31-299-4273

e-mail: sungwngkim@gmail.com

#### 細野 秀雄 HOSONO Hideo

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒 226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259

TEL: 045-924-5134

e-mail: hosono@msl.titech.ac.jp